

波長分散型蛍光X線分析システム（上面型）

■機器の概要

試料にX線を照射し発生する蛍光X線を測定することで、主にセラミックス、金属、樹脂等に含まれる元素の定性分析・定量分析を行うことができます。波長分散型のため精度の高い測定結果が得られ、真空中で試料の上面からX線を照射できることから、様々な形態の試料（粉末・固体）に対応することができます。

■活用事例

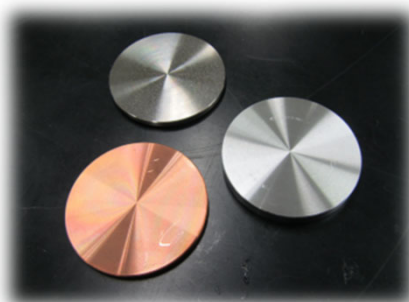
<セラミックスの成分分析>

粉末試料を加圧成形して測定します。

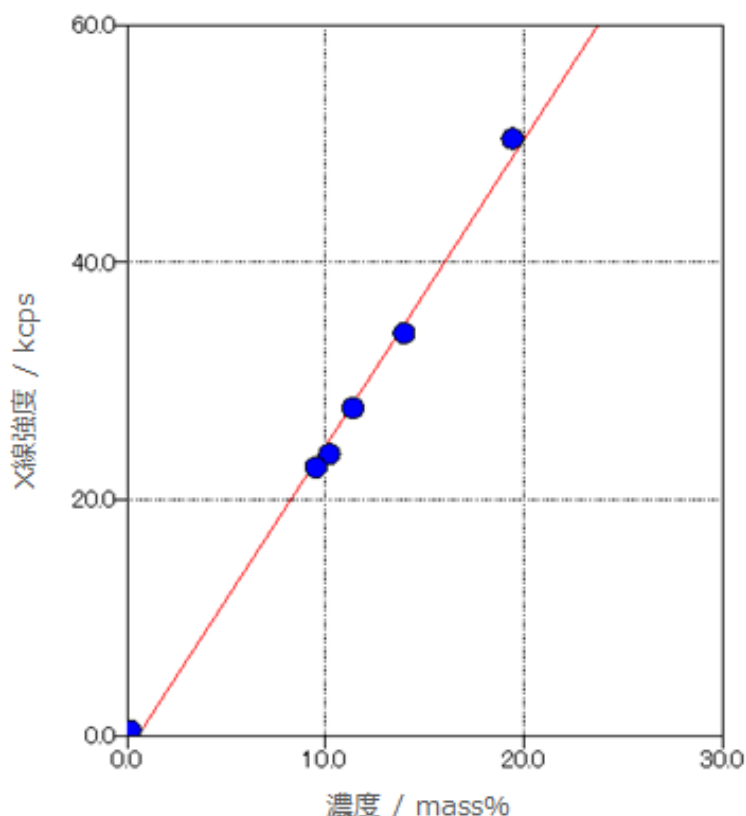


<金属の成分分析>

金属試料の表面を研磨して測定します。



ステンレス鋼に含まれるニッケルの検量線



■仕様・留意事項

主な仕様

- ・型式 : ZSX Primus IV
- ・メーカー : (株)リガク（日本）
- ・X線管 : 高輝度 4kW Rhターゲット
- ・照射方式 : 上面照射（試料の上側からX線を照射）
- ・測定元素 : Be～U
- ・測定試料 : 粉末・固体（セラミックス、金属、樹脂）
- ・測定雰囲気 : 真空（真空度安定化機構）

